

適合用於D、F、G、J、K級、晶片電阻、MELF電阻、引線電阻之分選機、測包機



- 對應極小晶片(低測定電力)
- 超高速:0.7msec.(代表值)
- 除去熱電動勢達到高精度、高穩定度
- 各檔位可設定測定值積分時間功能, 使得測定更加快速、更加穩定
- 絕對值測定:0.00mΩ~200.00MΩ,%測定:5mΩ~109MΩ [±99.99%]
- 接觸檢知(CONTACT CHECK)可選擇測定前/測定後/OFF執行
- 搭載RS-232C(GP-IB可另外選配)
- 搭載印表機輸出(Centronics基準)
- 搭載數據轉送功能(可將相同設定轉送至另一台AX-162E)
- 搭載測定電流、電壓異常檢知迴路

Specifications

測定範圍及準確度(周圍溫度23°C±5°C), 校正後180天[校正1年後為1.5倍]

測定檔位	STANDARD值設定範圍	測定電流	測定準確度	
			SLOW	FAST *
100mΩ	5mΩ ~ 109mΩ	100mA	±0.02%±2α±2d以內	±0.03%±3α±2d±[2/(1+n)]d以內
1Ω	109.1mΩ ~ 1.09Ω	100mA	±0.02%±α±1d以內	±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以內
10Ω	1.091Ω ~ 10.9Ω	50mA		
100Ω	10.91Ω ~ 109Ω	10mA	±0.02%±1d以內	±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以內
1kΩ	109.1Ω ~ 1.09kΩ	5mA		
10kΩ	1.091kΩ ~ 10.9kΩ	0.5mA		
100kΩ	10.91kΩ ~ 109kΩ	50μA		
1MΩ	109.1kΩ ~ 1.09MΩ	5μA	±0.03%±1d以內	±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以內
10MΩ	1.091MΩ ~ 10.9MΩ	0.5μA		
100MΩ	10.91MΩ ~ 109MΩ	0.05μA	±0.1%±2d以內	-----

d: digits n: 積分時間(msec)、%測定時: α=(100/STANDARD設定值mΩ)×0.01%、絕對值測定時: α=0(±1d)

* FAST為完全屏蔽狀態下之準確度

測定時間	外部啟動		Free Running	
	SLOW	FAST	SLOW	FAST
	AC1周期+約0.7msec.~約400msec.	約0.7msec.~約400msec.	約30次/秒~約25次/秒	約60次/秒~約50次/秒

測定結束信號(EOC)脈衝寬度	可設定1~250msec.及連續測定
測定方式	可切換四端點 / 二端點測定
判定值設定範圍	%測定: ±99.99% 絕對值測定: 00000~20000
使用周圍環境	溫度: 5°C~+40°C、濕度: 85%以下
電源需求	AC85V~265V、50/60Hz、約50VA
外觀尺寸	約333(W)×99(H)×300(D)mm (不包含橡膠墊等凸出物)
重量	約3.5kg

The Outline

AX-162E能以超高速、高準確地量測0.00mΩ~200MΩ大範圍之電阻。搭載微處理器可針對測值進行HI、GO、LO之判定並對外輸出信號。另外, 測量值能以偏差值(±99.9%)或電阻值(mas.20000計數)方式顯示。

本檢測計可切換測定速度, 可在各檔位分別設定FAST/SLOW積分時間。搭載接觸檢知(CONTACT CHECK)功能, 於四端點測定時, 當任一處有接觸不良狀況發生, 無關所測得數值, 都判定為HI, 並對外輸出HI信號及同時輸出接觸錯誤CE信號(CONTACT ERROR)。接觸檢知(CONTACT CHECK)可選擇於測定前/測定後/OFF執行。再者, 因具備常態性對測定電流、電壓監控功能, 當測定中有端點發生接觸狀態異常的情形, 將輸出NG判定信號。

標準搭載Centronics基準的印表輸出以及轉送已設定數據之RS-232C。印表輸出可記憶10000筆測定數據, 即使在列印中也可進行測定, 且可印出任意個數單位的統計結果。

可利用RS-232C、GP-IB(選配)輸出測定數據與設定標準電阻值、限制值等測定條件。而設定數據轉送功能, 可將設定好的檔位、標準值、限制值等相同的設定內容, 快速簡單地轉送到另一台AX-162E, 對於同時使用二台檢測計的操作極為方便(連接線另售)。

另外, 自前面板操作鍵來設定測定檔位時, 只要輸入標準電阻值, 搭載的微處理器將自動選出適合檔位, 可免除繁瑣的設定步驟, 其所設定的內容由電池儲存備份, 即使關閉電源也會保留。